



## IEC STANDARDS+



BASIC EMC PUBLICATION  
PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

**Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst  
immunity test**

**Compatibilité électromagnétique (CEM) –  
Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux transitoires  
électriques rapides en salves**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

ICS 33.100.20

ISBN 978-2-83220-016-2

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE



BASIC EMC PUBLICATION  
PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

**Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst  
immunity test**

**Compatibilité électromagnétique (CEM) –  
Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux transitoires  
électriques rapides en salves**

## CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope.....	7
2 Normative references .....	7
3 Terms, definitions and abbreviations .....	7
3.1 Terms and definitions .....	7
3.2 Abbreviations .....	10
4 General .....	10
5 Test levels.....	10
6 Test equipment.....	11
6.1 Overview .....	11
6.2 Burst generator .....	11
6.2.1 General .....	11
6.2.2 Characteristics of the fast transient/burst generator.....	12
6.2.3 Calibration of the characteristics of the fast transient/burst generator .....	14
6.3 Coupling/decoupling network for a.c./d.c. power port.....	15
6.3.1 Characteristics of the coupling/decoupling network.....	15
6.3.2 Calibration of the coupling/decoupling network .....	16
6.4 Capacitive coupling clamp .....	17
6.4.1 General .....	17
6.4.2 Calibration of the capacitive coupling clamp .....	18
7 Test setup .....	20
7.1 General.....	20
7.2 Test equipment .....	20
7.2.1 General .....	20
7.2.2 Verification of the test instrumentation.....	20
7.3 Test setup for type tests performed in laboratories .....	21
7.3.1 Test conditions .....	21
7.3.2 Methods of coupling the test voltage to the EUT .....	24
7.4 Test setup for in situ tests .....	26
7.4.1 Overview .....	26
7.4.2 Test on power ports and earth ports .....	26
7.4.3 Test on signal and control ports.....	27
8 Test procedure .....	28
8.1 General.....	28
8.2 Laboratory reference conditions .....	28
8.2.1 Climatic conditions .....	28
8.2.2 Electromagnetic conditions.....	28
8.3 Execution of the test.....	28
9 Evaluation of test results .....	29
10 Test report.....	29
Annex A (informative) Information on the electrical fast transients.....	30
Annex B (informative) Selection of the test levels.....	32
Annex C (informative) Measurement uncertainty (MU) considerations .....	34
Bibliography.....	43

Figure 1 – Simplified circuit diagram showing major elements of a fast transient/burst generator .....	12
Figure 2 – Representation of an electrical fast transient/burst .....	13
Figure 3 – Ideal waveform of a single pulse into a 50 Ω load with nominal parameters $t_r = 5$ ns and $t_w = 50$ ns .....	13
Figure 4 – Coupling/decoupling network for a.c./d.c. power mains supply ports/terminals .....	16
Figure 5 – Calibration of the waveform at the output of the coupling/decoupling network .....	17
Figure 6 – Example of a capacitive coupling clamp .....	18
Figure 7 – Transducer plate for coupling clamp calibration .....	19
Figure 8 – Calibration of a capacitive coupling clamp using the transducer plate .....	19
Figure 9 – Block diagram for electrical fast transient/burst immunity test .....	20
Figure 10 – Example of a verification setup of the capacitive coupling clamp .....	21
Figure 11 – Example of a test setup for laboratory type tests .....	22
Figure 12 – Example of test setup using a floor standing system of two EUTs .....	23
Figure 13 – Example of a test setup for equipment with elevated cable entries .....	24
Figure 14 – Example of a test setup for direct coupling of the test voltage to a.c./d.c. power ports for laboratory type tests .....	25
Figure 15 – Example for in situ test on a.c./d.c. power ports and protective earth terminals for stationary, floor standing EUT .....	26
Figure 16 – Example of in situ test on signal and control ports without the capacitive coupling clamp .....	27
Table 1 – Test levels .....	11
Table 2 – Output voltage peak values and repetition frequencies .....	15
Table C.1 – Example of uncertainty budget for voltage rise time ( $t_r$ ) .....	36
Table C.2 – Example of uncertainty budget for EFT/B peak voltage value ( $V_p$ ) .....	37
Table C.3 – Example of uncertainty budget for EFT/B voltage pulse width ( $t_w$ ) .....	38
Table C.4 – $\alpha$ factor (Equation (C.4)) of different unidirectional impulse responses corresponding to the same bandwidth of the system $B$ .....	40

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

### **ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –**

### **Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test**

#### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-4 has been prepared by subcommittee 77B: High frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms Part 4-4 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107, *Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications*.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2004 and its amendment 1 (2010) and constitutes a technical revision.

This third edition improves and clarifies simulator specifications, test criteria and test setups.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
77B/670/FDIS	77B/673/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The list of all currently available parts of the IEC 61000 series, under the general title *Electromagnetic compatibility (EMC)*, can be found on the IEC web site.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**

## INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts, according to the following structure:

### **Part 1: General**

General considerations (introduction, fundamental principles)

Definitions, terminology

### **Part 2: Environment**

Description of the environment

Classification of the environment

Compatibility levels

### **Part 3: Limits**

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibility of the product committees)

### **Part 4: Testing and measurement techniques**

Measurement techniques

Testing techniques

### **Part 5: Installation and mitigation guidelines**

Installation guidelines

Mitigation methods and devices

### **Part 6: Generic standards**

### **Part 9: Miscellaneous**

Each part is further subdivided into several parts, published either as international standards or as technical specifications or technical reports, some of which have already been published as sections. Others are published with the part number followed by a dash and a second number identifying the subdivision (example: IEC 61000-6-1).

This part is an international standard which gives immunity requirements and test procedures related to electrical fast transients/bursts.

## **ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –**

### **Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test**

#### **1 Scope**

This part of IEC 61000 relates to the immunity of electrical and electronic equipment to repetitive electrical fast transients. It gives immunity requirements and test procedures related to electrical fast transients/bursts. It additionally defines ranges of test levels and establishes test procedures.

The object of this standard is to establish a common and reproducible reference in order to evaluate the immunity of electrical and electronic equipment when subjected to electrical fast transient/bursts on supply, signal, control and earth ports. The test method documented in this part of IEC 61000 describes a consistent method to assess the immunity of an equipment or system against a defined phenomenon.

NOTE As described in IEC Guide 107, this is a basic EMC publication for use by product committees of the IEC. As also stated in Guide 107, the IEC product committees are responsible for determining whether this immunity test standard is applied or not, and if applied, they are responsible for determining the appropriate test levels and performance criteria.<sup>1</sup>

The standard defines:

- test voltage waveform;
- range of test levels;
- test equipment;
- calibration and verification procedures of test equipment;
- test setups;
- test procedure.

The standard gives specifications for laboratory and in situ tests.

#### **2 Normative references**

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-161:1990, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 161: Electromagnetic compatibility*

---

<sup>1</sup> TC 77 and its subcommittees are prepared to co-operate with product committees in the evaluation of the value of particular immunity tests for their products.



## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	46
INTRODUCTION.....	48
1 Domaine d'application .....	49
2 Références normatives.....	49
3 Termes, définitions et abréviations .....	50
3.1 Termes et définitions .....	50
3.2 Abréviations .....	52
4 Généralités.....	52
5 Niveaux d'essai .....	52
6 Matériel d'essai .....	53
6.1 Vue d'ensemble.....	53
6.2 Générateur de salves .....	53
6.2.1 Généralités.....	53
6.2.2 Caractéristiques du générateur de transitoires rapides en salves .....	54
6.2.3 Etalonnage des caractéristiques du générateur de transitoires rapides en salves .....	56
6.3 Réseau de couplage/découplage pour l'accès alimentation en courant alternatif et continu.....	57
6.3.1 Caractéristiques du réseau de couplage/découplage .....	57
6.3.2 Etalonnage du réseau de couplage/découplage.....	58
6.4 Pince de couplage capacitive .....	59
6.4.1 Généralités.....	59
6.4.2 Etalonnage de la pince de couplage capacitive.....	60
7 Montage d'essai .....	62
7.1 Généralités.....	62
7.2 Matériel d'essai .....	62
7.2.1 Généralités.....	62
7.2.2 Vérification de l'instrumentation d'essai .....	62
7.3 Montage d'essai pour les essais de type en laboratoire .....	63
7.3.1 Conditions d'essai .....	63
7.3.2 Méthodes de couplage de la tension d'essai à l'EST.....	66
7.4 Montage d'essai pour essais in situ .....	68
7.4.1 Vue d'ensemble.....	68
7.4.2 Essai sur les accès alimentation et sur les bornes de terre de protection .....	68
7.4.3 Essai sur les accès signal et commande.....	69
8 Procédure d'essai.....	70
8.1 Généralités.....	70
8.2 Conditions de référence en laboratoire .....	70
8.2.1 Conditions climatiques.....	70
8.2.2 Conditions électromagnétiques.....	70
8.3 Exécution de l'essai.....	70
9 Evaluation des résultats d'essai .....	71
10 Rapport d'essai .....	71
Annexe A (informative) Informations sur les transitoires électriques rapides.....	73
Annexe B (informative) Sélection des niveaux d'essai .....	75

Annexe C (informative) Considérations relatives aux incertitudes de mesure (IM) .....	77
Bibliographie.....	87
Figure 1 – Schéma simplifié montrant les éléments principaux d'un générateur de transitoires rapides en salves .....	54
Figure 2 – Représentation des transitoires rapides en salves.....	55
Figure 3 – Forme d'onde idéale d'une impulsion unique dans une charge de 50 Ω avec les paramètres nominaux $t_r = 5$ ns et $t_w = 50$ ns .....	55
Figure 4 – Réseau de couplage/découplage pour accès et bornes d'alimentation en courant alternatif ou en courant continu .....	58
Figure 5 – Etalonnage de la forme d'onde à la sortie du réseau de couplage/découplage .....	59
Figure 6 – Exemple d'une pince de couplage capacitive.....	60
Figure 7 – Plaque transducteur pour l'étalonnage de la pince de couplage .....	61
Figure 8 – Etalonnage de la pince de couplage capacitive en utilisant la plaque transducteur .....	61
Figure 9 – Diagramme synoptique de l'essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves.....	62
Figure 10 – Exemple d'installation de vérification d'une pince de couplage capacitive.....	63
Figure 11 – Exemple de montage d'essai pour les essais de type en laboratoire.....	64
Figure 12 – Exemple de montage d'essai utilisant un système de deux EST posés au sol .....	65
Figure 13 – Exemple de montage d'essai pour un matériel comportant des entrées de câble par le haut.....	66
Figure 14 – Exemple de montage d'essai pour le couplage direct de la tension d'essai aux accès alimentation en courant alternatif ou en courant continu destiné aux essais de type en laboratoire .....	67
Figure 15 – Exemple d'essai in situ sur les accès d'alimentation en courant alternatif ou en courant continu sur les bornes de terre de protection pour des EST fixes montés au sol .....	68
Figure 16 – Exemple d'essais in situ sur les accès signal et commande sans la pince de couplage capacitive .....	69
Tableau 1 – Niveaux d'essai .....	53
Tableau 2 – Fréquences de répétition des impulsions et valeurs de crête des tensions de sortie .....	57
Tableau C.1 – Exemple de bilan d'incertitude relatif au temps de montée de la tension ( $t_r$ ) .....	79
Tableau C.2 – Exemple de bilan d'incertitude relatif à la valeur de tension crête ( $V_P$ ) des TER/S .....	80
Tableau C.3 – Exemple de bilan d'incertitude relatif à la largeur d'impulsion de la tension ( $t_w$ ) des TER/S .....	81
Tableau C.4 – Facteur $\alpha$ (équation (C.4)) de différentes réponses impulsionnelles unidirectionnelles correspondant à la même bande passante du système $B$ .....	84

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –

#### **Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves**

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61000-4-4 a été établie par le sous-comité 77B: Phénomènes haute fréquence, du comité d'études 77: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la Partie 4-4 de la CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en CEM en accord avec le Guide 107 de la CEI.

La présente troisième édition annule et remplace la deuxième édition, parue en 2004, et son amendement 1 (2010) et elle constitue une révision technique.

La présente troisième édition améliore et clarifie les spécifications du simulateur, les critères et les montages d'essai.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
77B/670/FDIS	77B/673/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 61000, publiées sous le titre général *Compatibilité électromagnétique (CEM)*, peut être trouvée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

**IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Par conséquent, il convient que les utilisateurs impriment cette publication en utilisant une imprimante couleur.**

## INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties séparées, conformément à la structure suivante:

### **Partie 1: Généralités**

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

### **Partie 2: Environnement**

Description de l'environnement

Classification de l'environnement

Niveaux de compatibilité

### **Partie 3: Limites**

Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure où elles ne relèvent pas des Comités de produits)

### **Partie 4: Techniques d'essai et de mesure**

Techniques de mesure

Techniques d'essai

### **Partie 5: Guide d'installation et d'atténuation**

Guide d'installation

Méthodes et dispositifs d'atténuation

### **Partie 6: Normes génériques**

### **Partie 9: Divers**

Chaque partie est à son tour subdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme normes internationales soit comme spécifications techniques ou rapports techniques, dont certaines ont déjà été publiées comme sections. D'autres sont publiées avec le numéro de partie, suivi d'un tiret et complété d'un second numéro identifiant la subdivision (exemple: CEI 61000-6-1).

La présente partie est une Norme internationale qui donne les exigences d'immunité et les procédures d'essai relatives aux transitoires électriques rapides en salves.

## COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –

### Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61000 concerne l'immunité des matériels électriques et électroniques aux transitoires rapides répétitifs. Elle donne les exigences d'immunité et les procédures d'essai relatives aux transitoires électriques rapides en salves. Elle définit en outre des gammes de niveaux d'essais et établit des procédures d'essai.

L'objet de la présente norme est d'établir une référence commune et reproductible dans le but d'évaluer l'immunité des matériels électriques et électroniques quand ils sont soumis aux transitoires électriques rapides en salves sur les accès d'alimentation, de signal, de commande et de terre. La méthode d'essai documentée dans la présente partie de la CEI 61000 décrit une méthode cohérente dans le but d'évaluer l'immunité d'un matériel ou système vis-à-vis d'un phénomène défini.

NOTE Comme décrit dans le Guide 107 de la CEI, c'est une publication fondamentale en CEM pour l'utilisation par les Comités de produits de la CEI. Comme indiqué également dans le Guide 107, les Comités de produits de la CEI ont la responsabilité de déterminer s'ils appliquent ou non cette norme d'essai d'immunité et, si c'est le cas, ils ont la responsabilité de déterminer les niveaux d'essai et les critères de performance appropriés.<sup>1</sup>

La norme définit:

- la forme d'onde de l'essai en tension;
- la gamme des niveaux d'essais;
- le matériel d'essai;
- les procédures d'étalonnage et de vérification du matériel d'essai;
- les montages d'essai;
- la procédure d'essai.

La norme donne des spécifications pour les essais menés en laboratoire et les essais in situ.

#### 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60050-161:1990, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique*

---

<sup>1</sup> Le Comité d'études 77 et ses Sous-comités sont prêts à coopérer avec les Comités de produits à l'évaluation de la valeur des essais d'immunité particuliers pour leurs produits.

## REDLINE VERSION



BASIC EMC PUBLICATION  
PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

**Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst  
immunity test**

**Compatibilité électromagnétique (CEM) –  
Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux transitoires  
électriques rapides en salves**

## CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope.....	7
2 Normative references.....	7
3 Terms, definitions <b>and abbreviations</b> .....	8
<b>3.1 Terms and definitions</b> .....	8
<b>3.2 Abbreviations</b> .....	10
4 General.....	10
5 Test levels.....	10
6 Test equipment.....	11
<b>6.1 Overview</b> .....	11
6.2 Burst generator.....	11
<b>6.2.1 General</b> .....	11
6.2.2 Characteristics of the fast transient/burst generator.....	12
6.2.3 <del>Verification</del> <b>Calibration</b> of the characteristics of the fast transient/burst generator.....	14
6.3 Coupling/decoupling network for a.c./d.c. <del>mains supply power</del> <b>port</b> .....	16
6.3.1 Characteristics of the coupling/decoupling network.....	16
6.3.2 <del>Verification of the characteristics</del> <b>Calibration</b> of the coupling/decoupling network.....	16
6.4 Capacitive coupling clamp.....	18
<b>6.4.1 General</b> .....	18
<b>6.4.2 Calibration of the capacitive coupling clamp</b> .....	19
7 Test setup.....	20
<b>7.1 General</b> .....	20
7.2 Test equipment.....	21
<b>7.2.1 General</b> .....	21
<b>7.2.2 Verification of the test instrumentation</b> .....	21
7.3 Test setup for type tests performed in laboratories.....	22
7.3.1 Test conditions.....	22
7.3.2 Methods of coupling the test voltage to the EUT.....	25
7.4 Test setup for <del>post-installations in situ</del> tests.....	27
<b>7.4.1 Overview</b> .....	27
7.4.2 Test on power <del>supply</del> <b>ports</b> and earth ports.....	27
7.4.3 Test on <del>I/O and communication</del> <b>signal and control</b> ports.....	28
8 Test procedure.....	29
<b>8.1 General</b> .....	29
8.2 Laboratory reference conditions.....	29
8.2.1 Climatic conditions.....	30
8.2.2 Electromagnetic conditions.....	30
8.3 Execution of the test.....	30
9 Evaluation of test results.....	30
10 Test report.....	31



Annex A (informative) Information on the electrical fast transients .....	39
Annex B (informative) Selection of the test levels .....	41
<b>Annex C (informative) Measurement uncertainty (MU) considerations .....</b>	<b>43</b>
Bibliography.....	52
Figure 1 – Simplified circuit diagram <b>showing major elements</b> of a fast transient/burst generator .....	12
Figure 2 – <del>General graph of a</del> Representation of an electrical fast transient/burst.....	13
<del>Figure 3 – Waveshape of a single pulse into a 50 Ω load .....</del>	<del>.....</del>
Figure 3 – Ideal waveform of a single pulse into a 50 Ω load with nominal parameters $t_r = 5$ ns and $t_w = 50$ ns .....	14
Figure 4 – Coupling/decoupling network for a.c./d.c. power mains supply ports/terminals.....	16
Figure 5 – Calibration of the waveform at the output of the coupling/decoupling network .....	18
Figure 6 – <del>Construction</del> Example of a capacitive coupling clamp.....	19
Figure 7 – Transducer plate for coupling clamp calibration.....	19
<del>Figure 8 – Example of a test set-up for rack mounted equipment .....</del>	<del>.....</del>
Figure 8 – Calibration of a capacitive coupling clamp using the transducer plate .....	20
Figure 9 – Block diagram for electrical fast transient/burst immunity test .....	21
<del>Figure 10 – Example of test set-up for application of the test voltage by the capacitive coupling clamp for laboratory test purposes .....</del>	<del>.....</del>
Figure 10 – Example of a verification setup of the capacitive coupling clamp .....	22
<del>Figure 11 – Example for post installation test on a.c./d.c. power supply ports and protective earth terminals for stationary, floor-mounted EUT .....</del>	<del>.....</del>
Figure 11 – Example of a test setup for laboratory type tests .....	22
<del>Figure 12 – Example for post installation test on a.c. mains supply port and protective earth terminals for non-stationary mounted EUT .....</del>	<del>.....</del>
Figure 12 – Example of test setup using a floor standing system of two EUTs.....	24
Figure 13 – Example of a test setup for equipment with elevated cable entries .....	25
Figure 14 – Example of a test setup for direct coupling of the test voltage to a.c./d.c. power supply ports/ <del>terminal</del> for laboratory <del>purposes</del> type tests .....	26
Figure 15 – Example for in situ test on a.c./d.c. power ports and protective earth terminals for stationary, floor standing EUT .....	27
Figure 16 – Example of <del>post installation</del> in situ test on <del>communications and I/O signal and control</del> ports without the capacitive coupling clamp .....	29
Table 1 – Test levels.....	11
Table 2 – Output voltage peak values and repetition <del>rates</del> frequencies .....	15
Table C.1 – Example of uncertainty budget for voltage rise time ( $t_r$ ) .....	45
Table C.2 – Example of uncertainty budget for EFT/B peak voltage value ( $V_P$ ) .....	46
Table C.3 – Example of uncertainty budget for EFT/B voltage pulse width ( $t_w$ ) .....	47
Table C.4 – $\alpha$ factor (Equation (C.4)) of different unidirectional impulse responses corresponding to the same bandwidth of the system $B$ .....	49

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

### ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –

#### Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test

#### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

#### DISCLAIMER

**This Redline version is not an official IEC Standard and is intended only to provide the user with an indication of what changes have been made to the previous version. Only the current version of the standard is to be considered the official document.**

**This Redline version provides you with a quick and easy way to compare all the changes between this standard and its previous edition. A vertical bar appears in the margin wherever a change has been made. Additions and deletions are displayed in red, with deletions being struck through.**

International Standard IEC 61000-4-4 has been prepared by subcommittee 77B: High frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms Part 4-4 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107, *Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications*.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2004 and its amendment 1 (2010) and constitutes a technical revision.

This third edition improves and clarifies simulator specifications, test criteria and test setups.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
77B/670/FDIS	77B/673/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The list of all currently available parts of the IEC 61000 series, under the general title *Electromagnetic compatibility (EMC)*, can be found on the IEC web site.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**

## INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts, according to the following structure:

### **Part 1: General**

- General considerations (introduction, fundamental principles)
- Definitions, terminology

### **Part 2: Environment**

- Description of the environment
- Classification of the environment
- Compatibility levels

### **Part 3: Limits**

- Emission limits
- Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibility of the product committees)

### **Part 4: Testing and measurement techniques**

- Measurement techniques
- Testing techniques

### **Part 5: Installation and mitigation guidelines**

- Installation guidelines
- Mitigation methods and devices

### **Part 6: Generic standards**

### **Part 9: Miscellaneous**

Each part is further subdivided into several parts, published either as international standards or as technical specifications or technical reports, some of which have already been published as sections. Others are published with the part number followed by a dash and a second number identifying the subdivision (example: IEC 61000-6-1).

This part is an international standard which gives immunity requirements and test procedures related to electrical fast transients/bursts.

## ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –

### Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test

#### 1 Scope

This part of IEC 61000-4 relates to the immunity of electrical and electronic equipment to repetitive electrical fast transients. It gives immunity requirements and test procedures related to electrical fast transients/bursts. It additionally defines ranges of test levels and establishes test procedures.

The object of this standard is to establish a common and reproducible reference in order to evaluate the immunity of electrical and electronic equipment when subjected to electrical fast transient/bursts on supply, signal, control and earth ports. The test method documented in this part of IEC 61000-4 describes a consistent method to assess the immunity of an equipment or system against a defined phenomenon.

NOTE As described in IEC Guide 107, this is a basic EMC publication for use by product committees of the IEC. As also stated in Guide 107, the IEC product committees are responsible for determining whether this immunity test standard ~~should be~~ is applied or not, and if applied, they are responsible for determining the appropriate test levels and performance criteria.<sup>1</sup>

The standard defines:

- test voltage waveform;
- range of test levels;
- test equipment;
- **calibration and** verification procedures of test equipment;
- test setups;
- test procedure.

The standard gives specifications for laboratory and **post-installation in situ** tests.

#### 2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-161:1990, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 161: Electromagnetic compatibility*

<sup>1</sup> TC 77 and its subcommittees are prepared to co-operate with product committees in the evaluation of the value of particular immunity tests for their products.